

主催：日本分析化学会 X線分析研究懇談会

## 日本分析化学会 X線分析研究懇談会第 280 回例会

日本分析化学会 X線分析研究懇談会 委員長  
辻 幸一

平素より本研究懇談会へのご協力を賜りありがとうございます。

下記のとおり、X線分析研究懇談会第280回例会を下記の通り、開催いたします。

懇談会会員・非会員を問わず、多くの方のご参加をお待ちしております。

### 記

1. 日 時： 2024 年 1 月 19 日（金）15:00 ～ 17:20
2. 場 所：(株)リガク 東京クロス・ポイント 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-32-10  
アクセス案内図は次頁をご参照ください。
3. プログラム：
  - 1) ご挨拶 <15:00～15:10> 表 和彦 (リガク)
  - 2) 講演 1 <15:10～16:00> 河合 潤 (京都大学名誉教授)  
「特性X線を用いた化学状態分析と化学状態イメージング」
  - 3) 講演 2 <16:00～16:30> 高原 晃里 (リガク アプリラボ XRF分析グループ)  
「X線発光分光法によるリチウムイオン二次電池の状態分析」
  - 4) 講演 3 <16:30～17:00> 吉元 政嗣 (リガク X線研究所 先端解析技術研究部)  
「X線, 中性子全散乱データとRMC法による三元系正極材の局所構造解析」
  - 5) サテライトラボ見学 <17:00～17:20>
  - 6) 懇親会 (同会場にて) <17:20～19:00>
4. 参加費：無料 懇親会費：2,000円 (当日徴収)

参加ご希望の方は、**2024年1月12日(金)までに** メールにてご連絡をお願いします。

メールの件名は、「280回例会」としてください。

※ 参加者の事前登録が必要ですので、**締め切り厳守**をお願いします。

1月19日の午前中に、リガク東京工場（場所 東京都昭島市松原町3丁目9-1 2）の見学を希望される方は、ご連絡の際にお申し出ください。

問い合わせ・参加申し込み先：

(株)リガク 高原 晃里 (E-mail: [hikari@rigaku.co.jp](mailto:hikari@rigaku.co.jp))  
丸岡 由香子 (E-mail: [yukako-m@rigaku.co.jp](mailto:yukako-m@rigaku.co.jp))

## <例会会場：アクセス案内図>



### ■住所

東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-32-10  
 南新宿 SKビル 5階  
 TEL : 03-5312-7077  
 FAX : 03-5312-7078

### ■交通案内

JR 山手線 / 新宿駅・・・ ミライナタワー改札、新南改札 徒歩約 5 分  
 東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目駅  
 都営地下鉄新宿線 新宿三丁目駅・・・ E8 出口 徒歩約 3 分

### ■JR 新宿駅 からのご案内

- 1.新南改札口を出て左手に進みます。(地上 2 階)
- 2.高島屋デパート横の屋外エスカレーターがございまして、1 階へ下ります。
- 3.明治通りが見えたら、右手に進みます。
- 4.明治通り沿いに進みますと信号がございまして、道の反対側へ渡ります。
- 5.さらに進みますと、Gap Japan が 1 階に入ったビルが見えてきます。  
こちらが南新宿 SK ビルになります。
- 6.ビルの入り口は Gap の右手にございまして。
- 7.エレベーターホールを進んで頂き、奥のエレベーターで 5 階へお上がり下さい。